

Elektroonikaaparatuuri töökindluse arvutamine : metoodiline juhend

1977 https://www.ester.ee/record=b1266100*est

Impulsstehtnik : skeemid, diagrammid = Импульсная техника : схемы, диаграммы

1972 https://www.ester.ee/record=b1326260*es

Impulsstehtnika laboratoorse töde juhend

Rätsep, Ülo; Schults, Eduard 1972 https://www.ester.ee/record=b1324970*est

M-DM süsteemi alalispingevoimendi

Rätsep, Ülo Side. Raadio. Televisioon : infoseeria 10 1974 / lk. 11-16 : ill https://www.ester.ee/record=b1232303*est

Raadioinseneri ettevalmistus ja tegevus

Rätsep, Ülo Tallinna Polütehnik : TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee, ametiühingukomitee häälekandja 1987 / lk. 3
https://www.ester.ee/record=b1254708*es <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ecb9690a-69df-4903-bc42-f94c9a379d40>

Raadiotehnika. Saamisluhu ja areng

Rätsep, Ülo Tallinna Polütehnik : TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee, ametiühingukomitee häälekandja 1987 / lk. 2 : ill
https://www.ester.ee/record=b1254708*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ecb9690a-69df-4903-bc42-f94c9a379d40>

Teadusuuringud raadiotehnika kateedris alates 1966. aastast

Rätsep, Ülo Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1991 / lk. 4-7

Влияние технологического микроклимата на качество изделий микроэлектроники

Kaipoksin, L.; Puusepp, Ü.; Rätsep, Ülo; Teevet, J.-T. Электронная промышленность : ЭП : научно-технический сборник 1983 / с. 76-79 : илл https://www.ester.ee/record=b1802011*est

Измерительный модулятор на фоторезисторах

Valdna, Vello; Rätsep, Ülo; Jaakson, A. Республиканская научно-техническая конференция, посвященная Дню радио : тезисы докладов 1973 / с. 32 https://www.ester.ee/record=b1383925*est

Исследование влияния технологического микроклимата в производстве интегральных микросхем : автореферат ... кандидата технических наук (05.12.18)

Rätsep, Ülo 1983 https://www.ester.ee/record=b1522476*est

Классификация сигналов в реальном масштабе времени

Rätsep, Ülo; Ratassepp, Jaak Методы цифровой обработки и хранения радиотехнических сигналов 1987 / с. 3-6

Метод исследования комплексного влияния параметров технологического микроклимата на качество полупроводниковых интегральных микросхем

Rätsep, Ülo Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 81-82
https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Метод исследования технологического процесса производства интегральных микросхем, основанный на анализе кластеров состояний

Rätsep, Ülo; Teevet, J.-T. Методы и средства обработки сигналов при наличии шумов 1982 / с. 39-43
https://www.ester.ee/record=b1312255*est <https://www.etera.ee/zoom/121735/view?page=1&p=separate&search=true&tool=search>

Определение структуры статистических закономерностей методом кластеризации наблюдений

Budarin, Vladimir; Rätsep, Ülo; Teevet, J.-T. Электронная техника. Серия 9, Экономика и системы управления : научно-технический сборник 1981 / с. 45-49 : илл https://www.ester.ee/record=b2160900*est

Прогнозирование качества интегральных микросхем на основе кластеров состояний

Budarin, Vladimir; Rätsep, Ülo; Teevet, J.-T. Методы и средства цифровой обработки сигналов 1984 / с. 111-115

Радиотехника

Hinrikus, Hiie; Arro, Ilmar; Ratassepp, Jaak; Germ, Eduard; Sullakatko, Toomas; Niinsalu, Udo; Lumberg, Tõnu; Heinrichsen, Vladimir; Roosi, Aarne; Loitme, Olev; Gerasimtšuk, Valeri; Meister, Ants; Kangur, Oleg; Müller, E.; Andra, Andres; Kruming, Boris; Pungar, Eda-Tiia; Vichmann, Frederik; Jermakov, A.A.; Budarin, Vladimir; Rätsep, Ülo; Teevet, J.-T. 1984 https://www.ester.ee/record=b1302208*est

Радиотехника

Hinrikus, Hiie; Rätsep, Ülo; Ratassepp, Jaak; Niinsalu, Udo; Madar, Urve; Trump, Tõnu; Martverk, Peep; Raja, Aimur; Müller, E.; Meister, Ants; Allik, V.; Lumberg, Tõnu; Loitme, Olev; Kruming, Boris; Animägi, T.; Borštševski, A.I.; Kangur, Oleg 1987

https://www.ester.ee/record=b1273977*est

Руководство к лабораторным работам по импульсной технике

Rätsep, Ülo; Schults, Eduard 1971 https://www.ester.ee/record=b1421351*est

Системное исследование влияния технологического микроклимата на качество интегральных микросхем

Rätsep, Ülo Методы обработки и регистрации сигналов 1981 / с. 53-58 : илл https://www.ester.ee/record=b1507633*est
<https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b58bba27-822f-44c3-8387-50d8a26bb3d3>

Статистическое исследование влияния параметров технологического микроклимата на процесс изготовления изделий твердотельной электроники

Frid, M.; Rätsep, Ülo; Kailosin, L. Тезисы докладов и рекомендации научно-технических конференций, совещаний и семинаров по электронной технике. Серия 7, Технология, организация производства и оборудование 1981 / с. 6-8
https://www.ester.ee/record=b2880670*est